

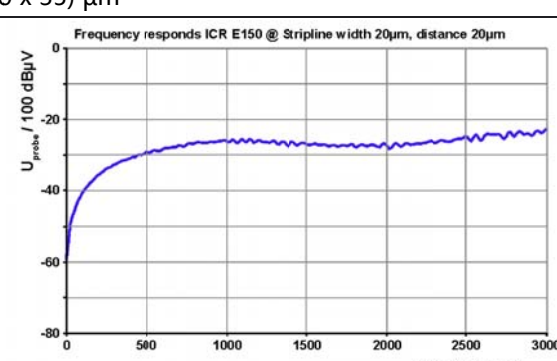
ICR E150 近场微电场探头

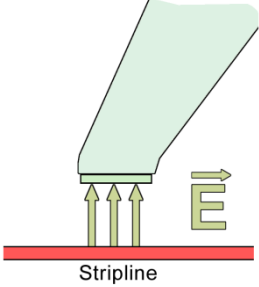
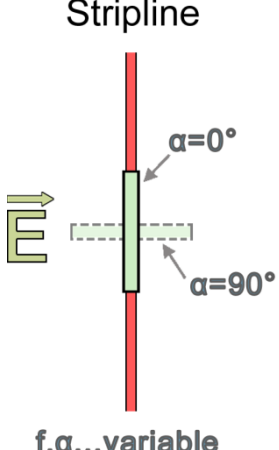
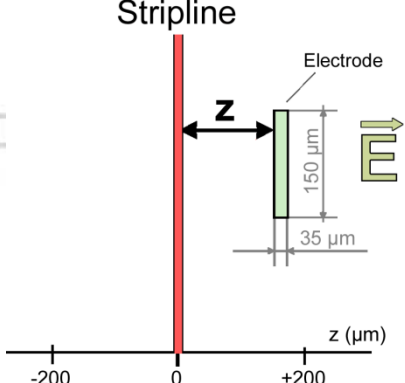
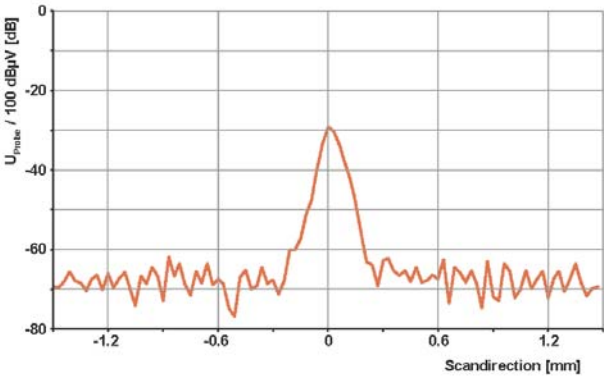


描述：

该探头以很高的分辨率和灵敏度来测量电场。距离被测物小于 1mm 时效果最佳。由于探头的尺寸非常小，它必须借助人工或自动定位系统（例如，Langer-扫描仪）来移动。该探头屏蔽磁场耦合。前置放大器集成在探头外壳中，探头外壳由 BT 706 T 型偏置供电。外壳上的调整螺钉允许将探针尖端手动对准探针外壳。探头支持 Langer 扫描仪的碰撞保护功能，在垂直移动过程中，如果触碰到被测设备，将停止移动。

具体指标：

频率范围	7 MHz ~ 3 GHz
分辨率	65 μm
电极面积	(150 x 35) μm
频率特性	 <p>Frequency response graph showing $U_{\text{probe}} / 100 \text{ dB}\mu\text{V}$ versus Frequency [MHz]. The graph title is "Frequency response ICR E150 @ Stripline width 20μm, distance 20μm". The y-axis ranges from -80 to 0 dBμV and the x-axis ranges from 0 to 3000 MHz. The curve shows a sharp rise from -80 dBμV at 0 MHz to approximately -30 dBμV at 500 MHz, then levels off around -30 dBμV up to 3000 MHz.</p>

<p>测量原理</p>	 <p>Stripline</p>
<p>设计视图 1</p>	 <p>Stripline</p> <p>$\alpha=0^\circ$</p> <p>$\alpha=90^\circ$</p> <p>$f, \alpha \dots \text{variable}$</p>
<p>设计视图 2</p>	 <p>Stripline</p> <p>Electrode</p> <p>z</p> <p>150 μm</p> <p>35 μm</p> <p>z (μm)</p> <p>-200 0 +200</p>
<p>横截面</p>	 <p>$U_{\text{probe}} / 100 \text{ dBuV} [\text{dB}]$</p> <p>Scandirection [mm]</p>



更专业的技术团队，一站式交钥匙工程
更经济的解决方案，贴合用户实际需求
更丰富的产品选择，集成主流厂商设备
更全面的贴心服务，完全摆脱后顾之忧



联系方式

北京世纪汇泽科技有限公司

Beijing Century Wisdom Science & Technology Ltd.

邮箱: info@emctest.org

地址: 北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座1108室

北京: +86 10 82732992 82732962 82732992 82732995

南京: +86 25 84528286

上海: +86 21 52911287

成都: +86 28 87435042

网址: www.emctest.org

苏州实验室: www.emctest.org.cn